インクリメンタル・マイクロフォーミングを活用した 機能性セラミックスの微細薄膜構造の三次元造形

東京大学 生産技術研究所 教授 帯川利之 (平成 22 年度一般研究開発助成 AF-2010013)

キーワード:インクリメンタルフォーミング,機能性セラミックス,薄膜,マイクロ加工,コーテイング, エッチング

1. 研究の背景と目的

ミクロな機能性構造体は、センサーやフィルターとし て、また生体用のマイクロテスター等としての利用が期 待されており、そのための形状や機能の創成技術の開発 が求められている.最終的に要求される大きさは十ミク ロンからサブミリサイズであるが、セラミックスが主体 の機能性材料では、比較的単純な形状のものが多い.ま た、機能の柔軟性を重視する場合、形状と表面の加工制 御性にすぐれた高能率加工技術のマイクロ化が要求さ れている.

マイクロスケールの加工に対するこうした要求を満 たすため、レーザや集束イオンビームなどによるマイク ロビーム加工の他、マイクロ放電加工、マイクロ切削加 工、インクリメンタル・マイクロフォーミング等、微細 な金型を必要としない種々の微細加工技術が鋭意研究 されている.

本研究では、機能性セラミックスの微細な膜状立体構 造のマイクロ加工技術を実現するため、インクリメンタ ル・マイクロフォーミングにコーティングとエッチング とを組み合わせた、フレキシビリティの高い加工技術の 開発を検討することとした.

2. 実験方法

本研究で考案したセラミック薄膜の三次元マイク ロ・メゾ構造体の成形法¹⁾²⁾の概略を図1に示す.ここ では、セラミック薄膜の微細な四角錐台の成形を想定し、 アルミ箔を黒で、セラミックスを白で表示した.最初に、 インクリメンタル・マイクロフォーミングによりアルミ 箔上に微細な四角錐台を成形する.次に特定のセラミッ クによりアルミ箔をコーティングし、その後、アルミと セラミックが積層したピラミッドからアルミ箔を選択 的にエッチングし、除去する.これらのプロセスにより、 ピラミッド部はセラミックス、それ以外の平坦部はアル ミ箔で補強されたセラミック複合膜を完成させる.

本研究で使用したインクリメンタル・マイクロフォー ミングの加工機³⁾ならびに加工状態を図2,3に示す. 本機は X-Y テーブル,Z ステージ, *θx-θy* ゴニオステ



図 1 機能性セラミックスの微細な膜状立体構造の 造形法







Blank holder 図 3 加工状態

ージ,スピンドル,成形工具およびブランクホルダーよ り構成される. X-Y テーブルの分解能は 0.01 μm,その 最小の送り速度は 0.0001 mm/s, Z ステージの分解能は 0.01 μm,ゴニオステージの分解能は 0.001°である.ゴニ オステージは薄膜の水平補正に用いられる.またスピン ドルの最高回転数は 25000 min⁻¹である.成形用の工具 には,図4に示す先端半径 10 μmの超微粒子超硬を使用 した.先端半径 10 μmの工具は破損しやすいので,同図 のようにテーパを付け,できる限り強度を高めた.

加工用薄膜(以下,ブランク)には厚さ12 μ mの業務 用アルミ箔 A8021H-O (97.95+%Al, 0.15%Si, 1.2–1.7%Fe, 0.05%Cu)を使用した.同材は特殊な熱処理により結晶 の微細化を図り,ピンホールの低減と伸びの増大(一般 の家庭用のアルミ箔の約2倍)を実現したものである. 技術資料⁴⁾によれば,厚さ12 μ mのA8021H-Oの引張試 験での伸びは約4%であるが,インクリメンタル・マイ クロフォーミングで成形する場合,80-100%の伸びが実 現される⁵⁾.

アルミ箔を保持するためのブランクホルダーの展開 図を図5に示す.アルミ箔に過大な張力を加えると成形 限界が低下し、一方、張力を加えないと箔がたわみ精度 が低下する.そこで、先行研究³⁾⁵⁾ではテンショナーと 呼ぶ突起と O リングによりアルミ箔に適度な張力を与 えるためのホルダーを考案した.しかし本実験では、ア ルミ箔の成形後にセラミックのコーティングを行うた め、アルミ箔を一定の温度まで加熱する.そのため、O リングを使用せずに、適度な張力を箔に与えるための単 純な機構のホルダーを使用した.

ー般に、インクリメンタルフォーミングでは、バッキ ングプレートと呼ばれる支持板を使用する⁶⁾.しかし、 加工寸法が微細になるとバッキングプレートの加工自 体が難しくなり、微細加工の障害となるので、これを使 用することのない加工を実現する必要がある.既報⁷⁾で は、主軸を高速で回転させ、水中で加工を行うと加工力 が低下するとともに、アルミ箔の変形が工具接触部に集 中することが明らかになった.そこで本研究でも同様に 還元水を加工液として使用し、バッキングプレートを使 用せずにアルミ箔の微細成形を行った.

シングルポイント工具によるインクリメンタル・マイ クロフォーミングの一例として,底辺の長さL,高さh, 対向する二等辺三角形のなす角 2 θ (以下では, θ を半頂 角と呼ぶ)のピラミッドの逐次成形プロセスを図6に示 す.ブランクの厚さはt,工具の回転速度は ω ,工具が一 回の加工で押し出す高さは dz である.したがって工具 が Z 方向に dz だけ移動する毎に,正方形をなす工具軌 跡の一辺は 2dx = 2dy = 2dz tan θ だけ縮小する.**表**1に上 面の辺の長さが 14µm の四角錐台をアルミ箔上に成形す るための条件を示す.ピラミッドの底面の辺の長さによ ってテープルの速度が変わることを除けば,成形条件は 一定である.なお, θ = 35.3°であることから,四角錐台



図4 マイクロ工具(先端半径10 µm)



図5 ブランクホルダー



図6 シングルポイント工具による逐次成形プロセス

表 1	上面の辺の長さ 14µm の四角錐台の成形条件
	(底面の辺の長さ <i>L</i> ,40 – 350 um)

Al foil thickness t	12 μm
Table speed V	$30-200 \ \mu m/s$
Tool tip radius	10 µm
Rotational speed ω	2000 min ⁻¹
Axial feed dz	1.0 μm
Side length of upper base	14 µm
Half apex angle θ	35.3 deg
Lubricant	Pure water

の側面におけるアルミ箔の伸びは、100(1/sin*θ*-1)=73% と非常に大きい.

次に、上記の方法でピラミッドを成形したアルミ箔に 高周波マグネトロンスパッタによりセラミックのコー ティングを行った. コーティングしたセラミックは TiN と HfO2 である. TiN のコーティングでは, スパッタし た Ti を窒素と反応させ、一方、HfO2のコーティングで は HfO,のターゲットを使用した.表2に TiN のコーテ ィング条件を示す. セラミックのコーティングであるた め、基材となるアルミ箔を加熱する必要がある. セラミ ックの PVD コーティングでは、一般に基材を 600°C 程 度まで加熱することが多いが, 600°C はアルミニウムの 融点よりわずか 60℃ 低いだけであり, 合金元素にもよ るがアルミ合金の固相線近傍の温度に相当する. したが って,アルミ箔の加熱温度は成形した形状の熱変形を防 止するため、できる限り低い温度に設定することにした. 表2の基材の温度450°Cは、研究室所有のスパッタ装置 においてコーティングしたセラミックの性状が悪化し ないための最低温度である.

最後の工程は、セラミックをコーティングすることに よってアルミとセラミックが積層したピラミッドの部 分から、アルミ箔を選択的にエッチングし、除去するプ ロセスである.エッチングには、調温器により一定温度 に保持された 1.94%KOH 水溶液を使用した.アルミ箔の エッチング速度とエッチング液の温度との関係を図7に 示す.なお、図に示したエッチング速度は、アルミ箔片 面での値である.この結果より、以下の実験ではエッチ ング液の温度を35℃とし、エッチング速度を0.5 μm/min に設定した.本条件では、厚さ12 μmの未変形のアルミ 箔と73%伸びた四角錐台の側面のアルミ箔をエッチン グで完全に溶かすために必要な時間は、エッチング速度 が塑性変形の影響を受けないと仮定した場合、それぞれ 24 分と13.9 分である.

3. 結果と考察

表1の条件で成形された上面の辺の長さが14 μm,底面の辺の長さが350 μm と140 μmの四角錐台の顕微鏡 写真を,それぞれ図8(a)と(b)に示す.いずれの成形状態も良好であるが,底辺の長さが140 μmになると,相対的に,上面の平坦部と成形工具の先端半径10 μmに起因する稜線の丸みが明確に見られるようになる.

次に TiN でコーティングされた個々のピラミッドの 状態を図9に示す.いずれも上面の辺の長さが 14 μm の 四角錐台,三角錐台,五角錐台であるが,底面の辺の長 さは異なる.三角錐台と五角錐台はコーティング時の加 熱による膨張とおそらく組織変化により,またコーティ ング後の収縮により大きく歪んでいるが,四角錐台では 歪みが比較的小さい.そこで,以下では,セラミックス の微細薄膜構造の形状を四角錐台に限定し,その作製状 態を検討することとした.

表 2 TiN のコーティング条件			
Target	Ti (purity 99.99%)		
Target DC power	140 W		
Coil power	30 W		
Ar flow rate	3.0 sccm		
N flow rate	0.7 sccm		
Pressure	0.16 Pa		
Bias	-40 V		
Substrate temperature	723 K (450°C)		
Time	3 h		



図7 アルミ箔のエッチング速度と温度との関係



(a) 底辺の長さ 350 µm



 (b) 底辺の長さ 140 μm
図 8 アルミ箔上に成形された上面の辺の長さが 14 μm の 5 個の四角錐台 (真上からの顕微鏡観察)



(a) 四角錐台



(b) 三角錐台



(c) 五角錐台
図 9 TiN でコーティングされた微細錐台
(上面の辺の長さ 14 µm)

5 個の微細四角錐台を成形したアルミ箔の上方から TiN と HfO₂のコーティングを行い, さらに 8 分間, エ ッチングをした後の顕微鏡写真を, それぞれ図 10 と図 11 に示す. なお, 両図の(a)と(b)はそれぞれピラミッド 上部と下部から撮影した写真である. 図 10 と 11 の(a) の写真からコーティング材による色の違い分かる. 光の あたり方にもよるが TiN は褐色を帯びた金色, HfO₂は 多少緑がかった白色であるが, セラミック膜の状態に関 してはエッチング前後での違いは見られなかった.

一方, ピラミッド下方からの観察では, ピラミッドの 下部だけ色が変化していることを確認できる. 窪んでい るため多少暗くなっているが, ピラミッドの裏側の色は 図 10(a)では褐色, 図 11(b)では暗緑色であり, 8 分間で アルミ箔がほぼ完全にエッチングされたことが分かる. 図 7 の結果より, 成形された四角錐台の側面のアルミ箔 をエッチングで完全に溶かすために必要な時間は, エッ チング速度が塑性変形の影響を受けないと仮定した場 合 13.9 分と算出されたが, 実際には 8 分でエッチングが 完了している. このことからインクリメンタル・フォー ミングにより成形されたピラミッドでは転位等の欠陥 が増え, エッチング速度が約 75%増大したと推測される. また厚さ 12 µm の未変形部分のアルミ箔では, 8 分の間 に約 4 µm だけエッチングされ, まだ 8 µm の厚さが残っ ているものと推定される.

以上の結果に基づいて,図12の形状と配列を有する 多数の微細ピラミッド群を,先ず,アルミ箔に成形し, 次いで,成形したアルミ箔に HfO₂のコーティングを施 し,最後に微細ピラミッドの部分のアルミ箔だけを KOH 水溶液でエッチングすることにより,セラミックスの微



(a) ピラミッド上部からの観察



(b) ピラミッド下部からの観察図 10 8 分間のエッチング後の顕微鏡写真(TiN)



(a) ピラミッド上部からの観察



(b) ピラミッド下部からの観察図 11 8分間のエッチング後の顕微鏡写真(HfO₂)

— 61 —



図 12 セラミックスの微細薄膜構造アレイとそれを構成する四角錐台の対角断面の寸法

細薄膜構造アレイを作製した.なお、本モデルにおいて も表1と同様に半頂角は θ = 35.3°である.図13に作製 した微細薄膜構造アレイの光学顕微鏡写真を示す.HfO₂ の膜厚は平坦部で 3µm である.同図(a)と(b)はいずれ もピラミッド上部からの顕微鏡写真であるが、(a)は上 方から投影された光による観察、(b)は透過光による観 察である.HfO₂は透明ではないが、3µm の厚さであれ ば十分に光を通すので、透過光での観察結果から、アル ミ箔がほぼ完全にエッチングされていることを確認で きる.

図13の微細薄膜構造アレイをSEMで観察した結果を 図14に示す.同図(a)は微細薄膜構造アレイの顕微鏡写 真,(b)は四角錐の寸法計測の結果である.真上から観 察した図13(a)と異なり,図14(a)では、コーティング 時の特に加熱による歪みが大きいことが分かる.図 10,11のようにピラミッドの数が少なく狭い範囲であれ ば問題はないが、多数の立体形状からなる広い範囲の微 細薄膜構造アレイを作製する場合には、熱変形への対策、 例えば、より低温でのセラミックコーティング技術の開 発等が必要になるものと思われる.

図 14(b)で計測された微細薄膜構造アレイのひとつの 四角錐台の寸法は、底面の辺の長さが 65µm,高さが 32µm である.図 12 の形状では底面の対角線長さが 100µm であるので、辺の長さは 70µm となる.したがっ て所定の寸法より少し小さめの四角錐台が出来上がっ たが、熱変形等による歪みの影響が大きいと考えられる.

4. 結論

本研究ではアルミ箔のマイクロ塑性加工技術とコー ティング、エッチングとを組み合わせ、セラミックスの 微細薄膜構造アレイを作製する技術を開発した.先ずイ ンクリメンタル・マイクロフォーミングによる微細ピラ



(a) ピラミッド上部からの観察(反射光)



(b) ピラミッド上部からの観察(透過光)
図 13 セラミックスの微細薄膜構造アレイの光学顕微鏡写真



(a) 微細薄膜構造アレイ



 (b) 成形されたピラミッドの寸法計測
図 14 セラミックスの微細薄膜構造アレイの SEM 観察

ラミッドの成形に関しては、ピラミッドの高さを抑え, 箔の伸びを 73%としたので,良好な成形が可能であった. 次にアルミ箔へのセラミックスのコーティングに関し ては,おそらく世界で初めての試みであるため他に参考 となる事例がないが,コーティング時の加熱によるアル ミ箔の熱変形が無視できないことが確認された.範囲の 狭い微細薄膜構造アレイであれば,大きな問題ではない が,多数の立体形状からなる広い範囲の微細薄膜構造ア レイを作製する場合には,熱変形への対策が必要となる. 例えば,より低温でのセラミックコーティング技術の開 発等が必要になるものと思われる.

アルミ箔のエッチングに関しては、微細薄膜構造アレ イ全体の強度を維持するため、未加工部分ではアルミ箔 を残し、加工された立体構造の部分のアルミ箔だけを選 択的にエッチングする必要がある.これについては、塑 性変形によりアルミ箔のエッチング速度が増大するこ とを利用するだけで、実質的に選択的なエッチングが可 能となることを見出し、微細薄膜構造アレイの製作に適 用した.その結果、マスキング等を全く使用する必要が なく、大変効率的なエッチングが実現できることが明ら かとなった.

本研究で開発したセラミックスの微細薄膜構造アレ イの製作法は,前例のない加工法であるため,技術的に 改善すべきことは多いと思われるが,加工技術の個々の 要素は難しいものではない.そのため,薄膜のセラミッ クセンサー等のラピッドプロトタイピングの手法とし て利用できるものと思われる.

謝辞

本研究の一部は公益財団法人天田財団の平成 22 年度 一般研究開発助成によるものである.記して深甚なる 謝意を表す.

参考文献

- 松本憲幸・帯川利之:2010 年度精密工学会春季大会 学術講演会講演論文集,(2010),1091-1092.
- T. Obikawa N. Matsumoto S. Togo T. Matsumura J. Leopold : Proc. 9th Int. Conf. THE "A" Coat. Manuf. Eng., Thessaloniki, (2011), 57-64.
- T. Sekine T. Obikawa : J. Adv. Mech. Des. Sys. Manuf., 4 (2010), 543-557.
- 4) http://www.saf.co.jp/A07-1sohaku.html
- T. Obikawa T. Hakutani T. Sekine S. Nakajiri T. Matsumura • M. Yoshino : J. Adv. Mech. Des. Sys. Manuf., 4 (2010), 1145-1156.
- 6) 井関日出男・加藤和典・坂本誠一郎:日本機械学会論 文集(C編),58-554 (1992),3147-3155.
- 7) T. Obikawa S. Satou T. Hakutani : Int. J. Mach. Tools Manuf., 49-12 (2009), 906-915.